

### NEWAGE9 ~神岡地下実験報告2~

日本物理学会63回年次大会 2008年3月23日 近畿大学

京都大学理学研究科西村広展 谷森達, 窪秀利,身内賢太朗,土屋兼一,株木重人, 高田淳司, 服部香里, 上野一樹,黒澤俊介, 井田知宏, 岩城智

#### 1, NEWAGE

(New generation WIMP search with an advanced gaseous tracker experiment)

- 2、神岡地下実験報告2
- 3、Geant4 BG Study

## 1、NEWAGE





◆ 方向感度をもつ WIMP直接探查実験 ↔ Gas検出器(現状) • 3D tracker with μ- TPC ● 24×27×31cm<sup>3</sup> 有感体積 •  $CF_4$  0.2atm 8.7g(fiducial) >100keV •  $\Delta E/E \sim 50\%$  (FWHM) @ 5MeV •  $\Delta \gamma \sim 15^{\circ}$  (HWHM) K.Miuchi et. al. PLB654(2007)58



## 3. Geant4 Background Study

#### ◆ Background 対策

Backgroundの理解が必要=現状スペクトルの理解。 原因箇所(ガス・ドリフトプレーン・GEM・μ-PIC等)の特定。

![](_page_3_Figure_3.jpeg)

![](_page_3_Figure_4.jpeg)

#### ◆ 100keV付近のエネルギースペクトルの説明

α線のエネルギー 4MeV~7MeV 崩壊位置、飛跡によって検出器に落とすエネルギーがかわる。

Detector Geometory ドリフトプレーンCu 3mm ガス(Detection area) GEM上面 5µm Cu GEM中 ポリイミド50µm GEM下面 5µm Cu uPIC面 5µm Cu

simulation

 Drift plane, GEM, uPIC, gas それぞれにおいてU系列、 Th系列のα線を発生。崩壊位置はそれぞれの物質中で一様

2. Detection area に落ちたエネルギー・場所を分解能を考慮し てoutput。

→上下面はcutなl

GEM-uPIC間はGEMゲインなしなのでdEは半分とする

3. 実データと同じfiducial volumeでcut

## ドリフトプレーン中のU,Thの影響

![](_page_5_Figure_1.jpeg)

Ou中でエネルギーlossのち放出
 5~8MeV→2~7MeV

数100keV以下で増える傾向

● 10ppb → ~1cts/keV/kg/days

# **GEM中のU,Thの影響**

#### GEM全体にU,Th が分布と仮定

![](_page_6_Figure_2.jpeg)

![](_page_7_Figure_0.jpeg)

- ◆ ピークで実データにあわせ規格化
- ◆ 低エネルギー側にGEMuPIC間成分
- ↔ 30cm領域でも数cts/keV/kg/days

## BackGround Study まとめ

- ◆ DriftPlane(天井) とGEM(上向き成分):
  - 現状は影響小
  - 10ppb →1cts/keV/kg/days なので

![](_page_8_Picture_4.jpeg)

#### ◆ uPIC-GEM間:

- GEMから
- uPICから
- 空間Rnから

低エネルギーに強い寄与。 他の影響の10~10<sup>2</sup>倍 これらの混じり合わせで現状 の可能性あり。

U,Th,Rnの分布の一様性

- + Rn(30cmvolume中)
  - 現状10%程度の寄与。数cts/keV/kg/days
    10<sup>-1</sup>~10<sup>-3</sup>の削減が必要

# BackGround 現状の対策計画

◆ DriftPlane(天井) とGEM(上向き成分):
 ● 材質選定: 無酸素銅 導電性テフロン
 ◆ uPIC-GEM間:

• GEM 高ゲインRUN: スペクトルが左に。

 GEMなし: uPIC単体 2007年版より歩留まり大幅改善 →uPICのBG源削減が必要?要確認

Rn(30cmvolume中)

■ Rnフィルターとガス循環により除去。

◆高さ方向の情報取得 (完全な粒子線VETOを。)

![](_page_9_Picture_7.jpeg)

開発研究中

## まとめ

◆ NEWAGE 2007年~ 神岡で動作中。 + Geant4を用いたα線Backgroundの再現 •天井 小 ● GEM – uPIC間効果 大 ● Rn 崩壊成分 中 >10%@100keV 低エネルギー部の完全な再現は未だ。 各材料のU、Th成分の測定が必要 1cts/keV/kg/daysのレベルではすべて考慮の必要あり

素材選び Rn除去フィルター

高さ情報取得

# **Background Origin**

# alpha or heavy particle (Inside Chamber) <sup>222</sup>Rn in U chain:

#### • U, Th in drift plane and GEM

![](_page_11_Figure_3.jpeg)

![](_page_12_Picture_0.jpeg)

## + 現状 10<sup>4</sup> pb + 当面30cm cube →10<sup>0</sup>~10<sup>-1</sup>

## Ethを下げて1桁 BGrateで3桁下げる

![](_page_12_Figure_3.jpeg)

![](_page_13_Figure_0.jpeg)

gamma efficiency < 2e-4 (statistics limited)

# 検出器応答

- ガラスに蒸着した<sup>10</sup>B (厚さ0.6µm)
- ・ドリフトケージ内部にセット、外から252Cfの中性子を減速して照射
- ・10B(n,a)7Li 反応 (Q=2.70MeV 1.8MeV for α)
- ・ 原子核による校正、低エネルギーへの線形性は別途確認示す必要あり
- ・現状では、校正には6時間程度、見せれる絵には12時間程度かかっている

![](_page_14_Figure_6.jpeg)

![](_page_15_Figure_0.jpeg)

![](_page_16_Figure_0.jpeg)